

УДК 537.311.33

© 1992

ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА ОТ СТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ, КВАНТОВЫМИ ПРОВОДАМИ И КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ

Е. Л. Ивченко, А. В. Кавокин

Установлена функциональная связь между коэффициентом отражения света *s*- или *p*-поляризации и огибающей волновой функции экситона в структуре с одиночной квантовой ямой, с решеткой квантовых проводов или с регулярной упаковкой квантовых точек. Коэффициент отражения рассчитывается с использованием теории локального диэлектрического отклика. Проведено сравнение радиационных времен жизни экситона в одиночной квантовой проволоке или точке и в структуре с решеткой таких проволок или точек.

1. Общие соотношения

Изучение спектра резонансного интерференционного отражения от структур с квантовыми ямами (КЯ) и сверхрешетками служит простым и надежным способом определения параметров экситонов в гетероструктурах [1–6]. Экситонное затухание оценивается в этом случае по ширине резонансной модуляции контура отражения, сила осциллятора для экситона — по амплитуде модуляции, а толщина покрывающего слоя (внешний барьер) — по форме резонансного контура [2, 5]. В настоящее время интерес вызывают не только (квази)двумерные системы типа структур с КЯ, но и одномерные, а также нульмерные системы, получившие название квантовых проводов (КП) и квантовых точек (КТ) соответственно [7, 8].¹ В данной работе рассчитано отражение света от структур с одиночной КЯ, с решеткой параллельных КП и с системой КТ, центры которых регулярно расположены в одной плоскости (см. рисунок, *a*—*e*). Квантовые провода и квантовые точки считаются изолированными друг от друга, т. е. перекрытием волновых функций экситонов, локализованных в соседних проводах или точках, пренебрегается.

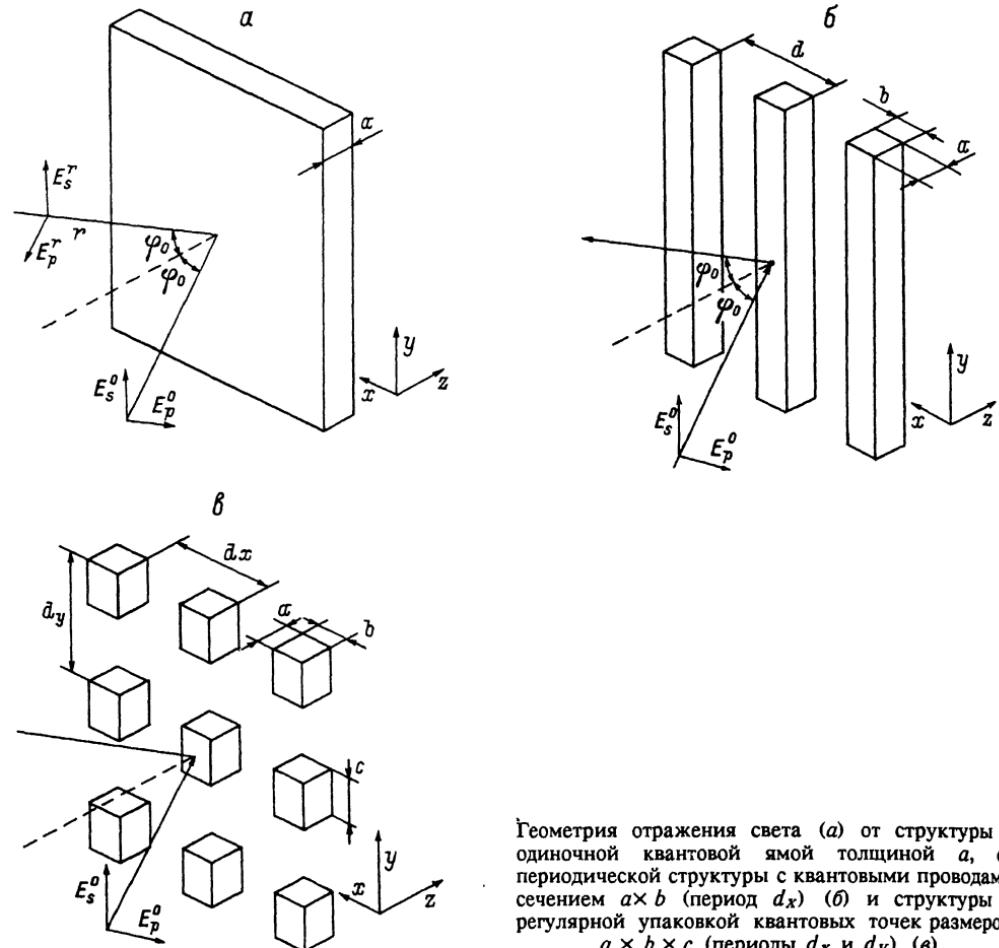
Как и в [6], рассматривается спектральная область вблизи резонансной частоты ω_0 основного состояния экситона в гетероструктуре, которое описывается огибающей волновой функцией $\Psi(r_e, r_h)$, где r_e, h — координаты электрона или дырки. В простейшей модели зонной структуры полупроводника вклад выделенного экситонного резонанса в диэлектрическую поляризацию $P_{exc}(r)$ можно представить в виде:

а) квантовая яма

$$4\pi P_{exc} = T \Phi_{OW}(z) \int \Phi_{OW}(z') E(x, y, z') dz', \quad (1a)$$

б) решетка квантовых проводов

¹ Влияние запаздывающего экситон-фотонного взаимодействия на спектр экситонов в одномерных и двумерных кристаллах было проанализировано Аграновичем и Дубовским еще в 1966 г. [9].



Геометрия отражения света (а) от структуры с одиночной квантовой ямой толщиной a , от периодической структуры с квантовыми проводами сечением $a \times b$ (период d_x) (б) и структуры с регулярной упаковкой квантовых точек размером $a \times b \times c$ (периоды d_x и d_y) (в).

$$4\pi P_{exc} = T \sum_n \Phi_{QWW}(\rho - R_n) \int \Phi_{QWW}(\rho' - R_n) E(x, y, z') d\rho', \quad (16)$$

в) система квантовых точек

$$4\pi P_{exc} = T \sum_{nm} \Phi_{QD}(r - R_{nm}) \int \Phi_{QD}(r' - R_{nm}) E(r') dr'. \quad (1b)$$

Здесь

$$T = \frac{\epsilon_b \omega_{LT} \pi a_B^3}{\omega_0 - \omega - i\Gamma}, \quad (2)$$

ϵ_b — фоновая диэлектрическая проницаемость; Γ — (нерадиационное) экситонное затухание; ω_{LT} — сила осциллятора, или продольно-поперечное расщепление экситона, введенное в [6]; a_B — боровский радиус экситона в объемном материале; множитель πa_B^3 выделен в (2) для удобства (см. [6]); ρ — двумерный вектор (x, z) (см. рисунок, б); $R_n = n d_x \mathbf{O}_x$, $R_{nm} = n d_x \mathbf{O}_x + m d_y \mathbf{O}_y$, $\mathbf{O}_{x,y}$ — единичный вектор вдоль оси x или y ; функции Φ связаны с огибающей $\Psi(r_e, r_h)$ соотношениями

$$\Psi_{QW}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{S}} \Phi_{QW}(z),$$

$$\Psi_{QWW}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{L_y}} \Phi_{QWW}(\boldsymbol{\rho}),$$

$$\Psi_{QD}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \Phi_{QD}(\mathbf{r}), \quad (3)$$

S — площадь поперечного сечения структуры с КЯ, L_y — длина провода. Заметим, что для структуры с КЯ типа GaAs/AlGaAs необходимо учитывать анизотропию силы осциллятора: для экситона с тяжелой дыркой (состояние $e1 - hh1$ (1s)) $\omega_{LT}^z \equiv \omega_{LT}$ ($E \parallel z$) = 0, $\omega_{LT}^x = \omega_{LT}^y$; для экситона с легкой дыркой (состояние $e1 - lh1$ (1s)) $\omega_{LT}^z > \omega_{LT}^x = \omega_{LT}^y \equiv \omega_{LT}$ ($E \perp z$). В основной части статьи поляризационная зависимость ω_{LT} не учитывается, в заключительной части будет указано, как изменяются результаты при различии величин ω_{LT}^α ($\alpha = x, y, z$).

В отличие от [4, 6] здесь выведено выражение для коэффициента отражения от квантовой ямы при наклонном падении на нее света p -поляризации, которое применимо при произвольной величине экситонного затухания. В отличие от [10], где коэффициент отражения от структуры с квантовыми проводами находился с использованием численных методов, мы рассмотрим предельные случаи, в которых можно установить прямое интегральное соотношение между спектром отражения и функцией $\Phi_{QWW}(\boldsymbol{\rho})$.

С учетом трансляционной симметрии структур, изображенных на рисунке, и выбранной геометрии электрическое поле можно представить в виде

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{QW}(z) e^{ik_x x}(a), \\ \mathbf{E}_{QWW}(x, z) e^{ik_x x}(\delta), \\ \mathbf{E}_{QD}(\mathbf{r}) e^{ik_x x}(\sigma), \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{QWW}(x + nd_x, z) &= \mathbf{E}_{QWW}(x, z), \\ \mathbf{E}_{QD}(x + nd_x, y, z) &= \mathbf{E}_{QD}(x, y + md_y, z) = \mathbf{E}_{QD}(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (4)$$

Это позволяет свести волновое уравнение

$$\text{rot rot E} = k_0^2 D, \quad D = \epsilon_b E + 4\pi P_{exc} \quad (5)$$

к эквивалентному интегральному уравнению

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^0 e^{ik_x x} + \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}),$$

$$\tilde{E}_\alpha^{QW}(\mathbf{r}) = k_0^2 T \int G_{ab}^{QW}(x, z - z') \Phi_{QW}(z') dz' \int \Phi_{QW}(z'') E_\beta^{QW}(z'') dz'',$$

$$\tilde{E}_\alpha^{QWW}(\mathbf{r}) = k_0^2 T \sum_n e^{in k_x d_x} \int G_{ab}^{QWW}(\boldsymbol{\rho} - \mathbf{R}_n - \boldsymbol{\rho}') \Phi_{QWW}(\boldsymbol{\rho}') d\boldsymbol{\rho}' \times$$

$$\times \int \Phi_{QWW}(\boldsymbol{\rho}'') E_\beta^{QWW},$$

$$\tilde{E}_\alpha^{QD}(\mathbf{r}) = k_0^2 T \sum_{nm} e^{ink_x d_x} \int G_{\alpha\beta}^{QD}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{nm} - \mathbf{r}') \Phi_{QD}(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' \times \\ \times \int \Phi_{QW}(\mathbf{r}'') E_\beta^{QW}(\mathbf{r}'') d\mathbf{r}'', \quad (6)$$

где

$$G_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = \left(\delta_{\alpha\beta} + \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2}{\partial r_\alpha \partial r_\beta} \right) \tilde{G}(\mathbf{r}), \\ \tilde{G}^{QW}(x, z) = \frac{i}{2k_z} \exp [i(k_z |z| + k_x x)], \\ \tilde{G}^{QWW}(\rho) = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k\rho), \\ \tilde{G}^{QD}(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}, \quad (7)$$

$H_0^{(1)}(z)$ — функция Ганкеля, $k^2 = k_0^2 \epsilon_b$. В (6) в качестве решения однородного волнового уравнения ($P_{exc} = 0$) выбрана плоская монохроматическая волна, падающая на структуру из полупространства $z < 0$. Плоскость падения совпадает с плоскостью (x, z) , так что $k_z = k \cos \varphi$, $k_x = k \sin \varphi$, $k_y = 0$.

2. Нормальное падение

Решение волнового уравнения для $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ при нормальном падении света на структуру b или c (см. рисунок; $k_x = 0$, $k_z = k$) характеризуется определенной симметрией к замене координат $x \rightarrow -x$ или $y \rightarrow -y$:

I) поляризация $\mathbf{E}^0 \parallel y$:

$$E_y(x, -y, z) = E_y(x, y, z), \quad -E_{x,z}(x, -y, z) = E_{x,z}(x, -y, z), \\ E_{y,z}(-x, y, z) = E_{y,z}(x, y, z), \quad -E_x(-x, y, z) = E_x(x, y, z), \quad (8)$$

II) поляризация $\mathbf{E}^0 \parallel x$

$$E_{x,z}(x, -y, z) = E_{x,z}(x, y, z), \quad -E_y(x, -y, z) = E_y(x, y, z), \\ E_x(-x, y, z) = E_x(x, y, z), \quad -E_{y,z}(-x, y, z) = E_{y,z}(x, y, z). \quad (9)$$

Так как для основного состояния экситона функции $\Phi_{QWW}(\rho)$ и $\Phi_{QD}(\mathbf{r})$ инвариантны к преобразованию координат $x \rightarrow -x$ или $y \rightarrow -y$, то

$$\Lambda_\beta^{QWW} \equiv \int \Phi_{QWW}(\rho) E_\beta^{QWW}(\rho) d\rho = \delta_{\beta\eta} \Lambda_\eta^{QWW}, \\ \Lambda_\beta^{QD} \equiv \int \Phi_{QD}(\mathbf{r}) E_\beta^{QD}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \delta_{\beta\eta} \Lambda_\eta^{QD}, \quad (10)$$

где $\eta = y$ для решений типа I и $\eta = x$ для решений типа II. Умножим левую и правую части (6) на $\Phi_{QWW}(\rho)$ или $\Phi_{QD}(\mathbf{r})$ и проинтегрируем по ρ или \mathbf{r} . В результате получим

$$\Lambda_{\eta}^{QWW} = \frac{E_{\eta}^0 \int \Phi_{QWW}(\rho) e^{ik_z z} d\rho}{1 + \Xi_{\eta}^{QWW}},$$

$$\Lambda_{\eta}^{QD} = \frac{E_{\eta}^0 \int \Phi_{QD}(r) e^{ik_z z} dr}{1 + \Xi_{\eta}^{QD}}, \quad (11a)$$

$$\Xi_{\eta}^{QWW} = k_0^2 T \iint d\rho d\rho' \Phi_{QWW}(\rho) \Phi_{QWW}(\rho') \sum_n G_{nn}^{QWW}(\rho - R_n - \rho'),$$

$$\Xi_{\eta}^{QD} = k_0^2 T \iint dr dr' \Phi_{QD}(r) \Phi_{QD}(r') \sum_{nm} G_{nm}^{QD}(r - R_{nm} - r'). \quad (11b)$$

Подставив (11) в (6), после некоторых преобразований приходим к следующему выражению для коэффициента отражения

$$r_{\eta} = \frac{E_{\eta}^r}{E_{\eta}^0} = \frac{i\gamma}{\tilde{\omega}_{0,\eta} - \omega - i(\Gamma + \Gamma_{\eta})}, \quad (12)$$

где для структуры с КП

$$\tilde{\omega}_{0,\eta} - i\tilde{\Gamma}_{\eta} = \omega_0 + k^2 \omega_{LT} \pi a_B^3 \iint d\rho d\rho' \Phi_{QWW}(\rho) \Phi_{QWW}(\rho') \times \sum_n G_{nn}^{QWW}(\rho - R_n - \rho'), \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \gamma &= -ik^2 \omega_{LT} \pi a_B^3 \int \Phi_{QWW}(\rho'') \cos kz'' d\rho'' \times \\ &\times \lim_{z \rightarrow -\infty} \left[\int \frac{dx}{L_x} \sum_n \int d\rho' G_{nn}^{QWW}(\rho - R_n - \rho') \Phi_{QWW}(\rho') e^{ikz} \right] = \\ &= \frac{k}{2d_x} \omega_{LT} \pi a_B^3 \left[\int \Phi_{QWW}(\rho) \cos kz d\rho \right]^2 \end{aligned} \quad (14)$$

и аналогичные выражения для структуры с КТ. Здесь L_x — размер образца вдоль оси x . Величина $\tau_{\eta} = (2\tilde{\Gamma}_{\eta})^{-1}$ есть радиационное время жизни экситона поляризации η , определяемое мнимой частью двойного интеграла в (13). Перенормировка резонансной частоты $\tilde{\omega}_{0,\eta} - \omega_0$ определяется реальной частью этого интеграла. Заметим, что с учетом второго слагаемого в (7) (производная по r_a и r_b) частоты $\tilde{\omega}_{0,x}$ и $\tilde{\omega}_{0,y}$ для структур с КП или КТ различаются, что и было получено при численном расчете в [10]. В выражении для γ проведено усреднение по x , так как r_x есть коэффициент зеркального отражения (дифракция нулевого порядка). При $k d_x > 2\pi$ во вторичном излучении присутствуют дифракционные лучи первого и иных порядков, амплитуда которых также может быть рассчитана с использованием формул (6), (11). При $k d_x > 2\pi$ затухание $\tilde{\Gamma}_{\eta}$ совпадает с γ и не зависит от состояния поляризации η . Для доказательства удобно использовать представление функции Грина в виде

$$\bar{G}^{QWW}(\rho) = \sum_{q_x q_z} \frac{e^{iq\rho}}{S(q^2 - k^2)}. \quad (15)$$

$$ka, kd_x \ll 1, \quad (16)$$

резонансная частота для решений типа I не перенормируется, для решений типа II

$$\tilde{\omega}_{0,x} - \omega_0 = \frac{1}{4} k^2 \omega_{LT} \pi a_B^3 \iint d\rho d\rho' \Phi_{QWW}(\rho) \Phi_{QWW}(\rho') \times \\ \times \sum_n \frac{N_1(k|\rho - \rho' - \mathbf{R}_n|)}{k|\rho - \rho' - \mathbf{R}_n|}, \quad (17)$$

а затухание в обоих случаях определяется формулой (14), в которой $\cos kz$ можно заменить на единицу. Здесь $N_1(t)$ — функция Неймана первого порядка.

В короткопериодичных структурах с КТ, у которых $kd_x, kd_y < 2\pi$, радиационное затухание равно

$$\tilde{\Gamma}_{QD} = \gamma_{QD} = \frac{1}{2} \frac{k}{d_x d_y} \omega_{LT} \pi a_B^3 \left[\int \Phi_{QD}(r) \cos kz dr \right]^2. \quad (18)$$

Для нахождения радиационного затухания экситона в одиночной КП (Γ_{SQWW}) или одиночной КТ (Γ_{SQD}) нужно в (11), (12) в суммах по n или m , t сохранить только одно слагаемое. При $ka, kd_x \ll 1$ (и $kd_y \ll 1$ в случае структуры с КТ) получаем следующую связь между радиационными затуханиями:

$$\tilde{\Gamma}_{QWW} = \frac{2}{kd_x} \tilde{\Gamma}_{y,SQWW}, \quad \tilde{\Gamma}_{y,SQWW} = 2\tilde{\Gamma}_{x,SQWW}, \\ \tilde{\Gamma}_{QD} = \frac{3\pi}{k^2 d_x d_y} \tilde{\Gamma}_{x,SQD}, \quad \tilde{\Gamma}_{x,SQD} = \tilde{\Gamma}_{y,SQD}. \quad (19)$$

3. Приближение постоянного поля

В этом приближении в выражении для вторичной волны $\tilde{E}(r)$ (см. [6]) вместо истинного поля E_β подставляется поле первичной волны E_β^0 . После выделения амплитуды зеркально-отраженной компоненты (дифракция нулевого порядка) и суммирования по n или по n, m получаем для коэффициента отражения $r = E'/E^0$ в s -поляризации

$$r_s = \frac{i\gamma_s}{\omega_0 - \omega - i\Gamma}, \quad (20)$$

где для квантовой ямы [6]

$$\gamma_s = \frac{1}{2} \frac{k^2}{k_z} \omega_{LT} \pi a_B^3 \left[\int \Phi_{QW}(z) \cos kz dz \right]^2, \quad (21a)$$

для решетки квантовых проводов или квантовых точек

$$\gamma_s = \gamma / \cos \varphi, \quad (216)$$

а величина γ определена согласно (14) или (18). Для коэффициента отражения в p -поляризации во всех трех случаях

$$\gamma_p = \cos 2\varphi \gamma_s. \quad (22)$$

Сравнение (12) и (20) показывает, что приближение постоянного поля применимо при условии $\Gamma \gg \tilde{\Gamma}$, и $|\omega_0 - \omega_0| \ll \omega_0$.

4. Наклонное падение света p -поляризации на квантовую яму

В этой геометрии отличны от нуля две компоненты электрического поля E_x и E_z . Подставляя функцию Грина $G^{QW}(x, z-z')$ в выражение для $\tilde{G}^{QW}(\mathbf{r})$ и выполняя дифференцирование по x , приходим к системе уравнений для E_x и E_z

$$E_x(\mathbf{r}) = E_x^0 e^{ikx} + k_z^2 \frac{k_0^2}{k^2} T \Lambda_x \int dz' \Phi_{QW}(z') \tilde{G}^{QW}(x, z-z') + \\ + ik_x \frac{k_0^2}{k^2} T \Lambda_z \int dz' \Phi_{QW}(z') \frac{\partial}{\partial z} \tilde{G}^{QW}(x, z-z'), \quad (23a)$$

$$E_z(\mathbf{r}) = E_z^0 e^{ikz} + ik_x \frac{k_0^2}{k^2} T \Lambda_x \int dz' \Phi_{QW}(z') \frac{\partial}{\partial z} \tilde{G}^{QW}(x, z-z') + \\ + k_0^2 T \Lambda_z \int dz' \Phi_{QW}(z') \left(1 + \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \tilde{G}^{QW}(x, z-z'), \quad (23b)$$

где

$$\Lambda_\alpha = \int \Phi_{QW}(z) E_\alpha(z) dz.$$

Умножив соотношения (23) на $\Phi_{QW}(z)$ и проинтегрировав по z , получим линейные уравнения для Λ_x и Λ_z . Подставив решения для Λ_x , Λ_z в (23a), находим окончательно

$$r_p^{QW} = \frac{i \tilde{\Gamma}}{\tilde{\omega}_0 - \omega - i(\Gamma + \tilde{\Gamma})} - \frac{i \tilde{\Gamma}'}{\tilde{\omega}'_0 - \omega - i(\Gamma + \tilde{\Gamma}')}. \quad (24)$$

Здесь $\tilde{\Gamma} = (k_z/k)^2 \gamma_s$, величина γ_s определена в (21a), $\tilde{\Gamma}' = (k_x/k_z)^2 \tilde{\Gamma}$, изменения резонансных частот

$$\tilde{\omega}'_0 - \omega_0 = \frac{1}{2} k_z \omega_{LT} \pi a_B^3 \iint dz dz' \Phi_{QW}(z) \Phi_{QW}(z') \sin k_z |z - z'|, \quad (25a)$$

$$\tilde{\omega}'_0 - \omega_0 = \omega_{LT} \pi a_B^3 \int \Phi^2(z) dz + (k_x/k_z)^2 (\tilde{\omega}_0 - \omega_0). \quad (25b)$$

Функция $r_p^{QW}(\omega)$ имеет полюсы в точках, определяющих частоту соответственно продольного экситона и поперечного поляритона необыкновенной поляризации в квантовой яме (см. [6]). Можно проверить, что при вещественных ω модуль r_p^{QW} не превышает единицы. При $\Gamma \gg \tilde{\Gamma}, \tilde{\Gamma}', |\tilde{\omega}_0 - \omega_0|, |\tilde{\omega}'_0 - \omega_0|$, когда применимо приближение постоянного поля, (24) переходит в (20), (22).

Аналогично можно рассчитать коэффициент отражения r_p для структур с КП или КТ, однако такой расчет станет актуальным лишь после получения образцов с малым значением нерадиационного затухания Γ .

При различии величин $\omega_{LT}^x, \omega_{LT}^y, \omega_{LT}^z$ приведенные выше конечные формулы для коэффициента отражения применимы при замене γ в (14) на $\gamma_x \propto \omega_{LT}^x, \gamma_y \propto \omega_{LT}^y$ и аналогичной замене $\tilde{\Gamma}_{QD} = \gamma_{QD}$ в (18), замене ω_{LT} в (21а) на $\omega_{LT}^y, \cos 2\varphi$ в (22) на

$$(\omega_{LT}^x \cos^2 \varphi - \omega_{LT}^z \sin^2 \varphi) \omega_{LT}^y,$$

замене $\tilde{\Gamma}$ и $\tilde{\Gamma}'$ в (24) на $\tilde{\Gamma}_x \propto \omega_{LT}^x$ и $\tilde{\Gamma}' \propto \omega_{LT}^z$ и ω_{LT} в (25а) и (25б) соответственно на ω_{LT}^x и ω_{LT}^z .

Таким образом, в настоящей работе установлена функциональная связь между коэффициентом экситонного отражения света и огибающей волновой функции экситона в структуре с одиночной КЯ, с решеткой КП или КТ. Это показывает, какие параметры экситонов в гетероструктурах можно извлечь из экспериментальных спектров отражения. С другой стороны, задаваясь определенной моделью зонной структуры полупроводника и рельефом сверхструктурного потенциала, можно независимо рассчитывать эти параметры и сравнивать их значения с найденными из эксперимента.

Список литературы

- [1] Schultheis L., Ploog K. // Phys. Rev. 1984. V. B30. N 2. P. 1090—1093.
- [2] Ивченко Е. Л., Копьев П. С., Кочерешко В. П., Уральцев И. Н., Яковлев Д. Р., Иванов С. В., Мельцер Б. Я., Калитеевский М. А. // ФТП. 1988. Т. 22. № 5. С. 784—788.
- [3] Ivchenko E. L., Kochereshko V. P., Kop'ev P. S., Kosobukin V. A., Uraltsev I. N., Yakovlev D. R. // Sol. St. Commun. 1989. V. 70. N 5. P. 529—534.
- [4] Andreany L. C., Tassone F., Bassani F. // Solid State Commun. 1990. V. 77. N 9. P. 641—645.
- [5] Ivchenko E. L., Kochereshko V. P., Uraltsev I. N. // Nova Science (New York). Studies in A. F. Ioffe Physico—Technical Institute. V. 15.
- [6] Ивченко Е. Л. // ФТП. 1991. Т. 33. № 8. С. 2388—2393.
- [7] Brown J. W., Spector H. N. // Phys. Rev. 1987. V. B35. N 6. P. 3009—3012.
- [8] D'Andrea A., Del Sole R. // Sol. St. Commun. 1990. V. 74. N 10. P. 1121—1124.
- [9] Агранович В. М., Дубовский О. А. // Письма в ЖЭТФ. 1966. Т. 3. № 9. С. 345—350.
- [10] D'Andrea A., Del Sole R. // Superlatt. Microstruct. 1990. V. 8. N 4. P. 425—427; Proc. of the Second International Meeting on Optics of Excitons in Confined Systems. Italy, 1991.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
3 февраля 1992 г.